F I Ş A D I S C I P L I N E I

Denumirea disciplinei	**Testare si Testabilitate**

Codul disciplinei	DIS404M	Semestrul	7	Numărul de credite	6

Facultatea	Electronica si telecomunicatii		Numărul orelor pe semestru				
Domeniul	Inginerie electronica si telecomunicatii		Total	C	S	L	P
Specializarea	Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii		84	42	-	28	14

Categoria formativă a disciplinei DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară	DS
Categoria de opționalitate a disciplinei DI – impusă, DO –opțională, DL –liber aleasă (facultativă)	DI

Discipline anterioare	Obligatorii (condiționare)	Circuite Integrate Digitale
	Recomandate	Bazele tehnologice ale microelectronicii

Obiective	- prezentarea modelelor de defecte logice utilizate in tehnologiile actuale - prezentarea tehnicilor de simulare a defectelor si de generare a testelor - prezentarea metodelor de testare a circuitelor - prezentarea tehnicilor de proiectare pentru testabilitate
Conținut (descriptori)	Defecte logice, defecte fizice. Detectia si localizarea defectelor. Generarea testelor. Simularea defectelor. Acoperirea defectelor. Redundanta. Testare compacta. Semnatura. Scanare. Arhitecturi Bilt-In Self-Test.

Sistemul de evaluare:			
Evaluarea finală*	Forma (E - examen, C - colocviu, VP - verificare pe parcurs)		E
	Probele evaluării prin E / C: 1. proiectare in Cadence – teme de casa (CC).....20% 2. teste pe parcurs (M) .....10% 3. examen scris – test cu 4 subiecte (T).....60%		
Stabilirea notei finale (procentaje)	Evaluare finală prin examen / colocviu		60%
	Evaluarea pe parcurs*	Activitatea la seminar / colocviu / proiect / practică	10%
		Teste pe parcurs [2]	10%
		Lucrări de specialitate, teme de casă [2]	20%
*) La toate formele de evaluare se precizează tipul: T - tradițional, CC - cu calculatorul, M – mixt.			
Titularul disciplinei	Gradul didactic, titlul, prenume, NUME		Semnătura
	Conf.dr.ing. Damian IMBREA		